



# ILV

## Institut Lavoisier de Versailles

### PASTEL DRX

#### Plateforme PASTEL - DRX

***Nom et description de la technique :***

La plateforme DRX du laboratoire est constituée de 5 diffractomètres. Les activités se concentrent essentiellement sur la caractérisation structurale de tous types de matériaux cristallisés par diffraction des rayons X.

***Equipement(s) :***

Diffractomètres poudre : D5000 Siemens, 2 D8 ADVANCE Bruker AXS

Diffractomètres monocristal : X8 APEX II Bruker AXS et D8 VENTURE Bruker AXS



***Type de matériaux/échantillons étudiés :***

Poudres cristallines et monocristaux

***Technologie(s) utilisée(s) :***

Diffraction des rayons X

***Spécificité(s) :***

Monocristal : microsource Molybdène, Basse température Cryostream 800+, détecteur photon III

Poudre : mesures en transmission – capillaire, chambre four haute température HTK 1200N, détecteur LynxEye

***Expertise(s) réalisable(s) :***

Matériaux polycristallins : analyse qualitative, analyse quantitative de phases, études microstructurales et détermination de structures cristallines

Echantillons monocristallins : résolution et affinement de structures tridimensionnelles

***Personne(s) responsable(s) à contacter :*** Jérôme Marrot

**Complément d'information**

***Mots clés :*** diffraction RX, phases cristallines, cristallographie